



株式会社アドバンテスト

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目6番2号
新丸の内センタービルディング
TEL: 03-3214-7500

担当: Judy Davies, Global Marketing Communications
+1 408-456-3717
judy.davies@advantest.com

報道関係 各位

株式会社アドバンテスト

「V93000 Smart Scale」を HiSilicon 社が採用

開発から量産まで、同社の全製品のテストに適用

株式会社アドバンテスト(本社：東京都千代田区 社長：松野晴夫)は、海思半導体有限公司 (HiSilicon Technologies Co., Ltd. 以下 HiSilicon) が無線端末やデジタル・メディア等の情報通信 IC の開発および量産試験向けに、テスト・システム「V93000 Smart Scale™」を採用したと発表しました。情報通信 ASIC などのチップセットメーカーである HiSilicon 社では、「V93000 Smart Scale™」を主要なテスト・システムとして、同社の全製品のテストに適用します。

HiSilicon 社のテストング・マネージャーである Lin Jianjun 氏は次のようにコメントを寄せています。「市場のさまざまなテスト・システムを調査した結果、『V93000 Smart Scale™』が最も広範囲の品種のテストをカバーし、テスト性能、コスト、歩留まりも優れていました。今度のテスト・システム立ち上げにあたって、当社および提携先の OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 各社は、アドバンテストのサービスとアプリケーション・サポートに大いに期待しています。」

デバイスの高速化と高性能化、ピン数の増加が進む今日、テスト・システムにはテスト・コストを抑えながらより優れた機能を提供することが求められています。業界最高レベルのスケラビリティを有する「V93000 Smart Scale™」は、高速デジタル試験と高精度のアナログおよび RF 測定を一台のシステムで提供します。これにより、コンシューマ市場向けのローコスト・テスト・ソリューションを実現したほか、プロトコル・コミュニケーションや最高 12.8Gbps のデータ・レートなどのハイエンド・テスト・ソリューションも可能としました。さらに、データ・レートは将来 16Gbps まで高速化する予定です。

「V93000 Smart Scale™」プラットフォームの機能は、「V93000」の全てのクラスにおいて利用可能です。開発用途と量産用途で異なるテスト・システム構成においても同じロード・ボードを使えるため、テスト・コストそして設備投資を最小限に抑えることができます。また、システムの稼働率向上、開発効率化による Time To Market の短縮、計画変更に対応できるフレキシビリティといったメリットを得ることができます。